































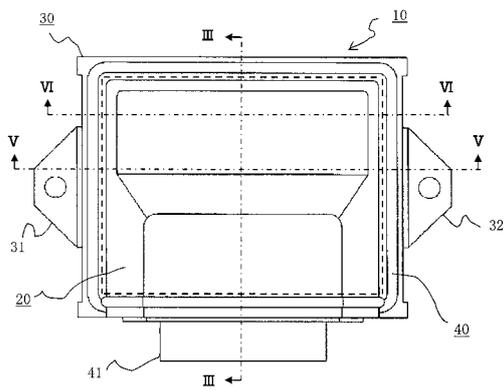




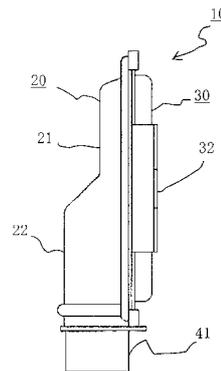
57a バイアホール  
G シール間隙  
G2 細隙部 (細隙寸法)

57b メッキ層  
G1 細隙部 (細隙寸法)

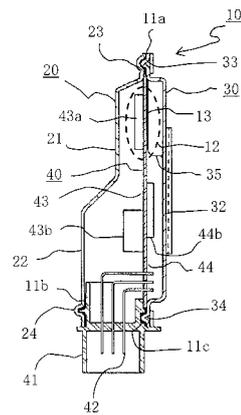
【図1】



【図2】

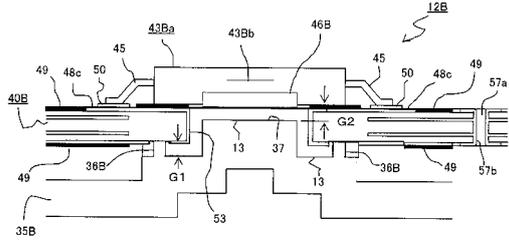


【図3】

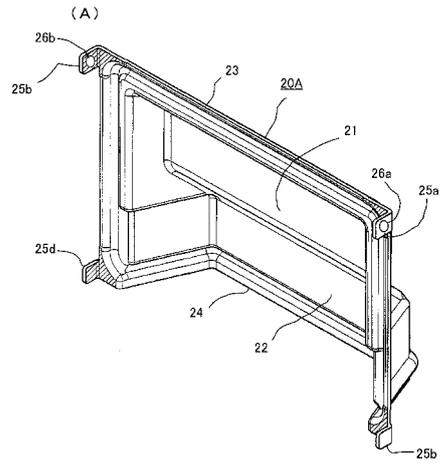




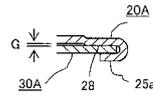
【 図 14 】



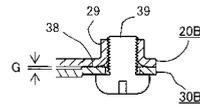
【 図 15 】



(B)



(C)



---

フロントページの続き

- (72)発明者 安積 功  
東京都千代田区九段北一丁目13番5号 三菱電機エンジニアリング株式会社内
- (72)発明者 松田 裕介  
東京都千代田区九段北一丁目13番5号 三菱電機エンジニアリング株式会社内
- (72)発明者 西馬 由岳  
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 三菱電機株式会社内

審査官 川内野 真介

- (56)参考文献 特開2003-258451(JP,A)  
特開2003-198165(JP,A)  
特開2004-304200(JP,A)  
特開2006-294754(JP,A)  
特開2004-006791(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H05K 7/20  
H05K 5/00-5/06